

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating		Unit
電 圧	電源電圧	V _{CC}	7.2		V
	回路電圧	V _{K-12}	-0.5	50	V
		V _{I3-12}	-0.5	14.4	V
		V _{I4-12}	-0.5	8	V
		V _{I7-12}	-0.5	8	V
電 流	回路電流	I _K	-5	30	mA
		I _{I3}	-5	25	mA
		I _{I4}	-5	100	mA
		I _{I5}	-5	10	mA
		I _{I6}	-5	10	mA
		I _{I7}	-5	10	mA
		I _{I8}	-5	10	mA
		I _{I9}	-5	10	mA
許容損失 (Ta=75°C)		P _D	600		mW
温度	動作周囲温度	T _{opr}	-20 ~ +75		°C
	保存温度	T _{stg}	-40 ~ +150		°C

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Item	Symbol	Test Circuit	Condition	min.	typ.	max.	Unit
出力飽和電圧(選局)	V _{OL(K)}	1	V _{CC} =4.8V, I _{OL} =5mA			0.15	V
出力リーク電流(選局)	I _{OH(K)}	2	V _{CC} =7.2V, V _{OH} =35V			5	μA
出力オン電圧(DEF)	V _{OL(D)}	3	V _{CC} =4.8V, I _{OL} =12.0mA			6	V
出力リーク電流(DEF)	I _{OH(D)}	4	V _{CC} =7.2V, V _{OH} =14.4V			5	μA
入力電流ローレベル(CHD, CHU)	I _{IL(CH)}	5,7	V _{CC} =7.2V, V _{IL} =0V	-5			μA
入力電流ハイレベル(CHD, CHU)	I _{IH(CH)} *1	6,8	V _{CC} =4.8V	50			μA
入力電流ローレベル(KIN)	I _{IL(K)}	9	V _{CC} =7.2V, V _{IL} =0V	-10			μA
入力電流ハイレベル(KIN)	I _{IH(K)} *2	10	V _{CC} =4.8V	200			μA
入力電流ローレベル(SKIP)	I _{IL(SK)}	11	V _{CC} =7.2V, V _{IL} =0V	-5			μA
入力電流ハイレベル(SKIP)	I _{IH(SK)} *3	12	V _{CC} =4.8V	50			μA
入力電流ローレベル(OSC)	I _{IL(OS)}	13	V _{CC} =7.2V, V _{IL} =1.0V			5	μA
入力電流ハイレベル(OSC)	I _{IH(OS)}	14	V _{CC} =4.8V, V _{IH} =4V	1.5		3.0	mA
発振周波数(Clock)	f _{OSC}	15	V _{CC} =6V	1.5	2.0	2.5	kHz
全回路電流	I _{tot}	16	V _{CC} =6V	52	66	80	mA

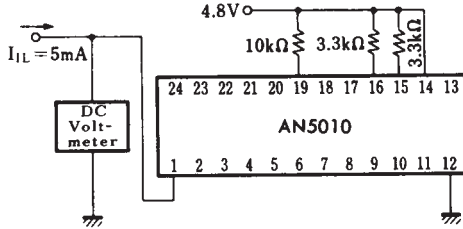
* 1 試験回路6, 8によりDEF Pin ⑬が“L”レベル(3.0V以上)であること。

* 2 試験回路10によりDEF Pin ⑬が“L”レベル(1.0V以下)であること。

* 3 試験回路12によりDEF Pin ⑬が“H”レベル(3.0V以上)であること。

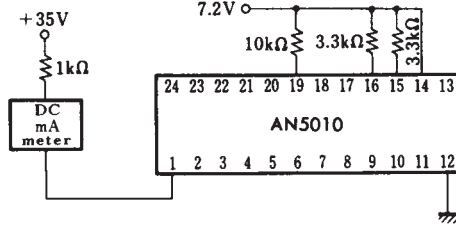
注) 動作電源電圧範囲 V_{CC(opr)} = 4.8 ~ 7.2V

Test Circuit 1 ($V_{OL(K)}$)



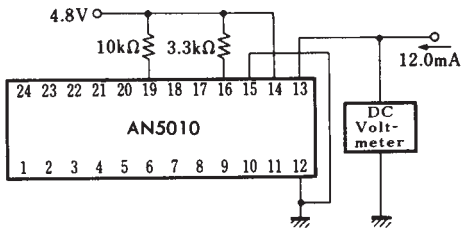
注) 測定端子は①~⑪と⑳~㉔の各端子。最初に端子⑱ (KIN)と⑪ (KJ)を短絡し、測定端子を⑪に設定する。その後、CHU, CHD端子をローレベルにし、K 1~K 16を順次測定する。測定端子以外は開放。

Test Circuit 2 ($V_{OH(K)}$)

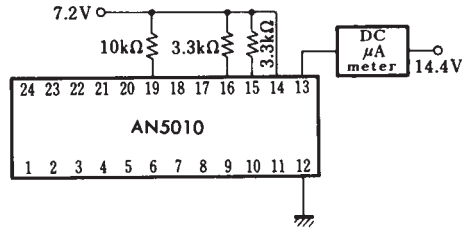


注) 測定端子は①~⑪と⑳~㉔の各端子。測定端子以外は開放。

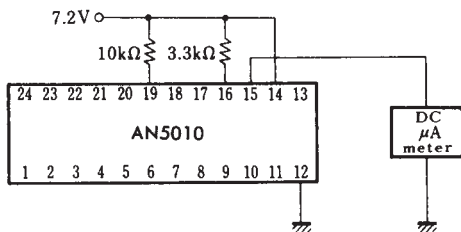
Test Circuit 3 ($V_{OL(D)}$)



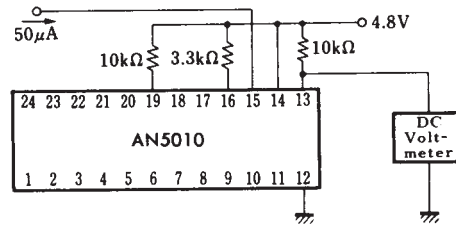
Test Circuit 4 ($I_{OH(D)}$)



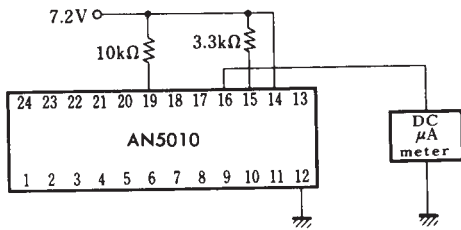
Test Circuit 5 ($I_{IL(CH)}$)



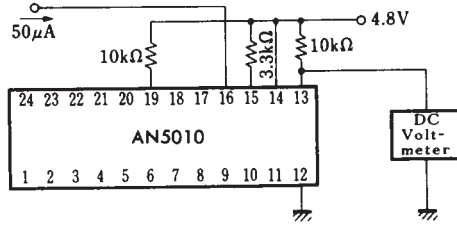
Test Circuit 6 ($I_{IH(CH)}$)



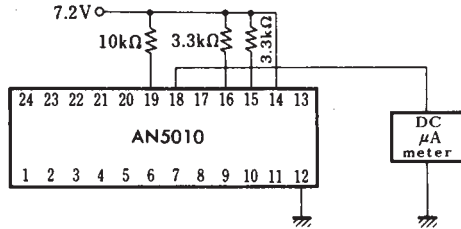
Test Circuit 7 ($I_{IL(CH)}$)



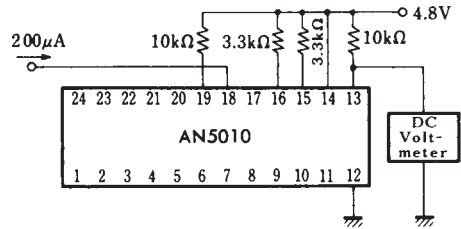
Test Circuit 8 ($I_{IH(CH)}$)



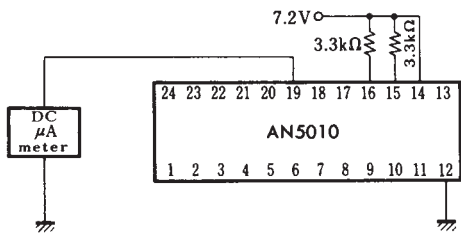
Test Circuit 9 ($I_{IL(KI)}$)



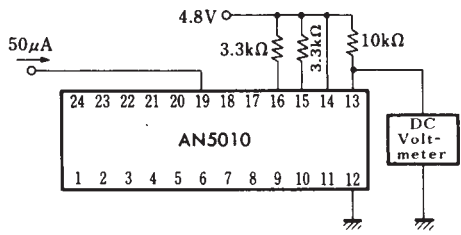
Test Circuit 10 ($I_{IH(KI)}$)



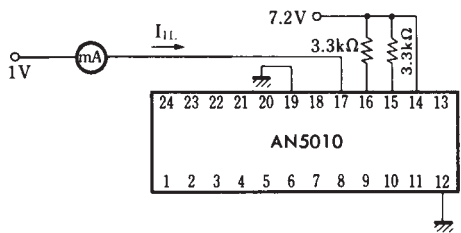
Test Circuit 11 ($I_{IL(SK)}$)



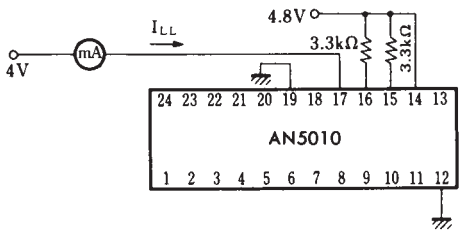
Test Circuit 12 ($I_{IH(SK)}$)



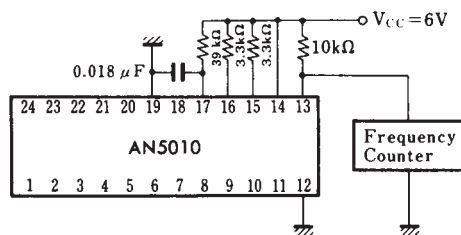
Test Circuit 13 ($I_{IL(OS)}$)



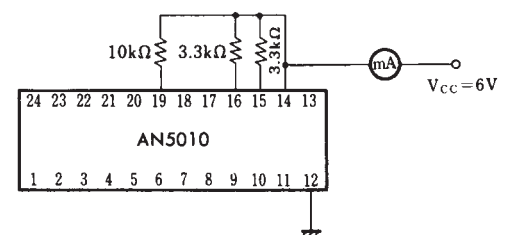
Test Circuit 14 ($I_{IH(OS)}$)



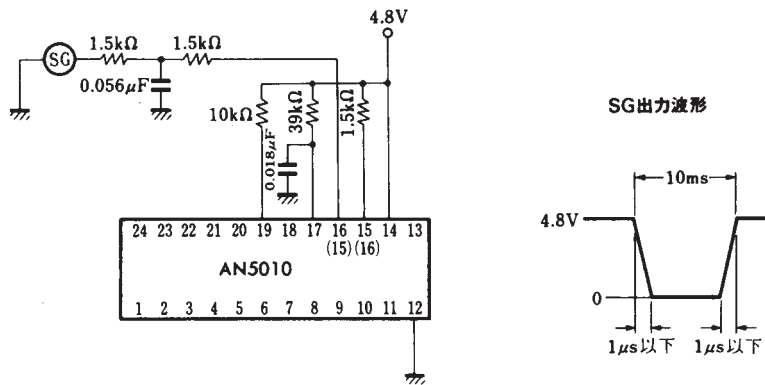
Test Circuit 15 (f_{osc})



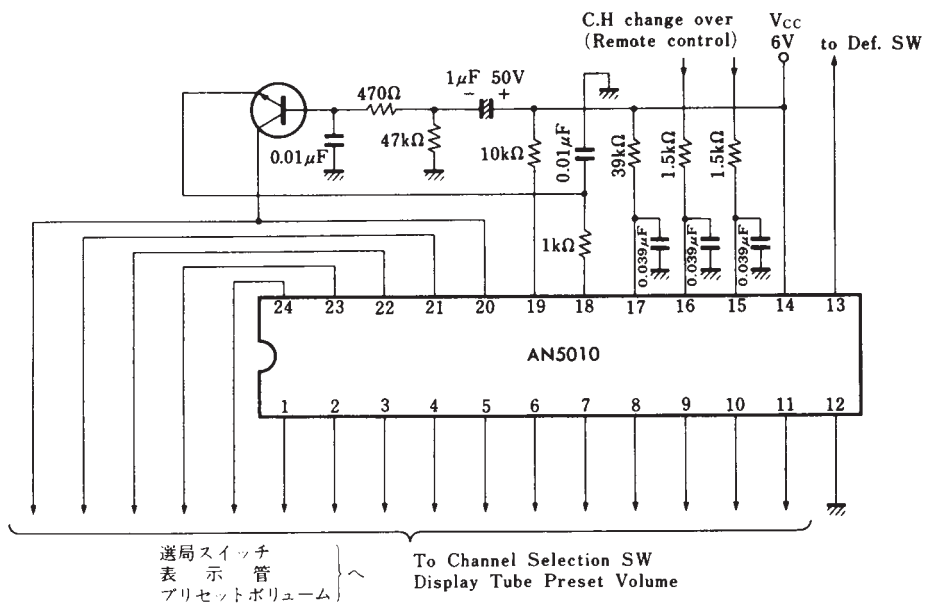
Test Circuit 16 (I_{tot})



Test Circuit 17 (CHU, CHD 入力による順次選局動作)



■ 応用回路例 / Application Circuit



■ 端子名 / Pin

Pin No.	端子名	Pin Name	Pin No.	端子名	Pin Name
1	選局出力 (11)	Ch.Selection Output (11)	13	AFT ディフェイト入力	AFT Defeat Input
2	選局出力 (10)	Ch.Selection Output (10)	14	電源電圧	V _{CC}
3	選局出力 (9)	Ch.Selection Output (9)	15	Ch. ダウン入力	Ch.Down Input
4	選局出力 (8)	Ch.Selection Output (8)	16	Ch. アップ入力	Ch.Up Input
5	選局出力 (7)	Ch.Selection Output (7)	17	発振フィルタ	Osc. Filter
6	選局出力 (6)	Ch.Selection Output (6)	18	キー入力	Key Input
7	選局出力 (5)	Ch.Selection Output (5)	19	スキップ入力	Skip Input
8	選局出力 (4)	Ch.Selection Output (4)	20	選局出力 (16)	Ch.Selection Output (16)
9	選局出力 (3)	Ch.Selection Output (3)	21	選局出力 (15)	Ch.Selection Output (15)
10	選局出力 (2)	Ch.Selection Output (2)	22	選局出力 (14)	Ch.Selection Output (14)
11	選局出力 (1)	Ch.Selection Output (1)	23	選局出力 (13)	Ch.Selection Output (13)
12	アース	GND	24	選局出力 (12)	Ch.Selection Output (12)